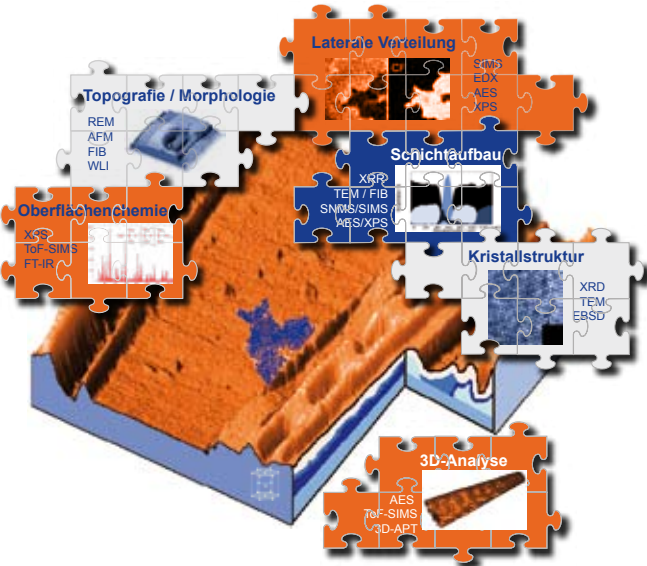
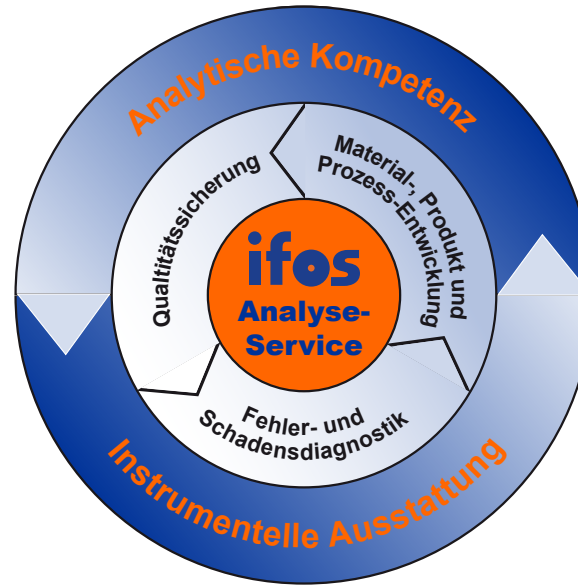


Das Ende der bloßen Vermutung



Oberflächenanalytik für

- Material-, Produkt- und Prozess-Entwicklung
- Fehler- und Schadensdiagnostik
- Qualitätssicherung



Kontakt :

Themenbereich: **Auftragsforschung**

Dr. Michael Wahl

Tel.: 0631-205-73-3333

Mail: wahl@ifos.uni-kl.de

Themenbereich: **Forschungsprojekte**

Prof. Dr. Michael Kopnarski

Tel.: 0631-205-73-3000

Mail: kopnarski@ifos.uni-kl.de

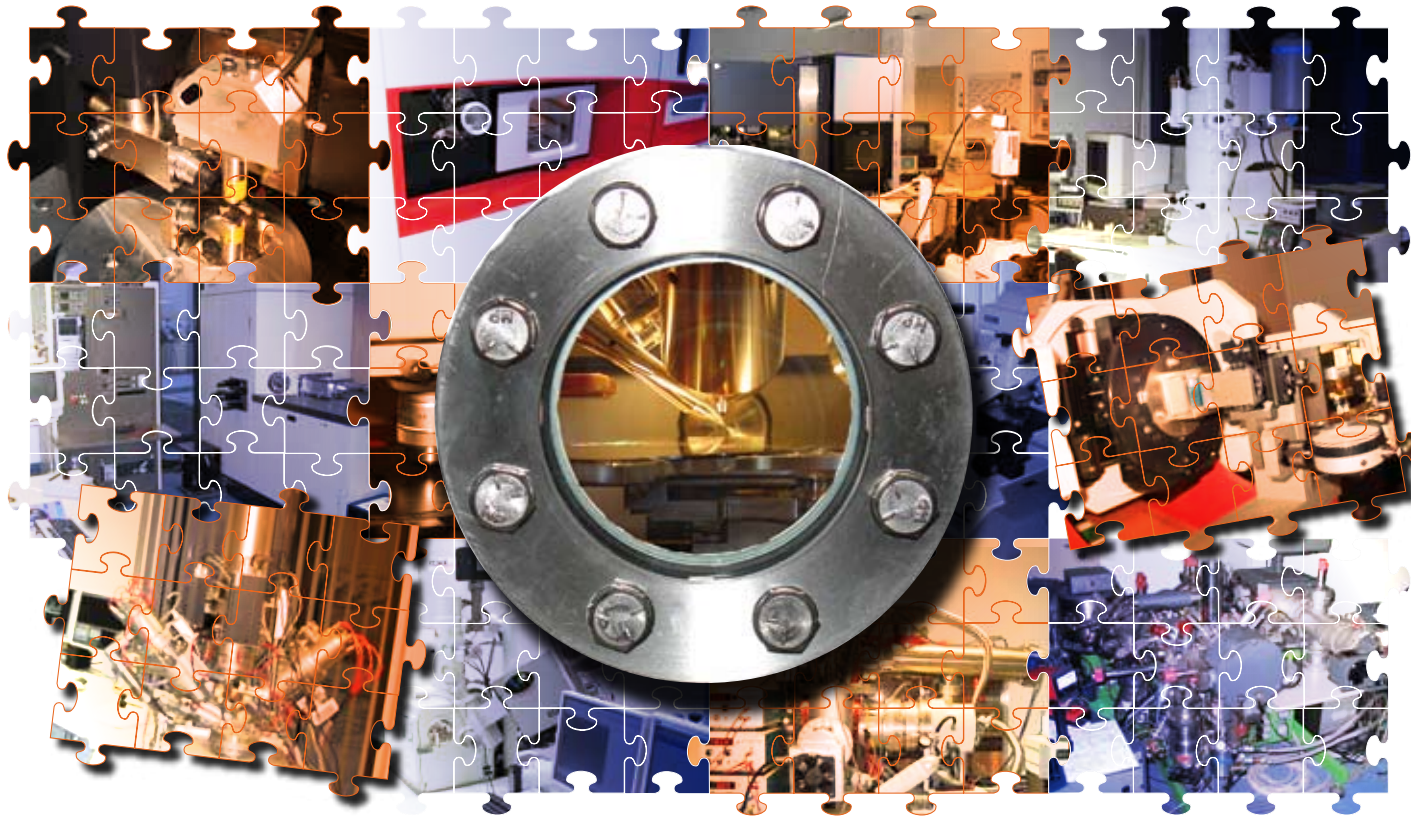
Trippstadter Straße 120, 67663 Kaiserslautern



Oberflächlich sehen Sie besser



Das IFOS besitzt eine moderne und nahezu vollständige instrumentelle Ausstattung mit Verfahren unterschiedlicher Nachweisstärke, Lateral- und Tiefenaufösung. Abhängig von Ihrer Aufgabenstellung setzen wir diese zielorientiert ein.



Oberflächen im Fokus



- **Forschung und Entwicklung** im Bereich der instrumentellen Oberflächenanalytik und Anwendung der Methoden auf Fragestellungen aus Technik und Forschung
- **Transfer** zwischen Universität, Industrie und Wirtschaft



Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik IFOS GmbH

Trippstadter Straße 120

67663 Kaiserslautern

Tel.: 0631-205-73-3001

Fax: 0631-205-73-3003

Mail: info@ifos.uni-kl.de

www.ifos-analytik.de / www.ifos.uni-kl.de

● **Elektronenspektroskopie**

AES / XPS / UPS

● **Oberflächenmassenspektrometrie**

Dyn. SIMS / ToF-SIMS

SNMS

3D-Atomprobe -Tomografie

● **Mikrobereichsanalyse**

REM incl. EDX, WDX und EBSD

FIB incl. EDX

● **Röntgenanalyse**

XRD / XRR

● **Nanobereichsanalyse**

aTEM incl. EDX, SAD und EELS

TEM-Präparation
(*Ultramikrotomie, Ionendünnen, FIB, ...*)

AFM / MFM

Mikro- und Nanoindentation

● **Sonstiges**

opt. Mikroskopie

FT-IR-, UV-ViS und Raman-Spektroskopie

Weißlichtinterferometrie

Kontaktwinkelanalyse

Metallografie

